

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магomedович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 21.09.2023 14:53:42

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Рабочая программа практики Тип практики **Преддипломная практика**

Закреплена за кафедрой Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль Технологии микро- и нанoeлектроники

Вид практики Производственная

Способ проведения практики

Форма проведения практики дискретно

Квалификация **Магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **21 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 756
в том числе: Формы контроля в семестрах:
зачет с оценкой 4

аудиторные занятия 0

самостоятельная работа 756

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	УП	РП		
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Сам. работа	756	756	756	756
Итого	756	756	756	756

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Подгорная С.В.

Рабочая программа

Преддипломная практика

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.04.04-МЭН-23-3.plx Технологии микро- и нанoeлектроники, утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, Технологии микро- и нанoeлектроники, утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра технологии материалов электроники

Протокол от 29.06.2022 г., №10

Руководитель подразделения д.ф.-м.н., профессор Костишин В.Г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Формирование компетенций в соответствии с учебным планом по программе бакалавриата 11.03.04 "Электроника и нанoeлектроника", а также приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
1.2	Задачи научно-исследовательской практики начать
1.3	Самостоятельному осуществлению научно-исследовательской работы, четкому формулированию и решению научных задач;
1.4	способности к научному творчеству, научно-исследовательскому и инновационному мышлению, владению методологией научного поиска;
1.5	получению новых научных результатов, имеющих важное значение для теории и практики, анализу и обработке полученных результатов с применением современных информационных технологий;
1.6	организации проведения научных исследований в составе творческого коллектива;
1.7	поиску, сбору и сравнительному анализу библиографических данных с привлечением современных информационных технологий;
1.8	представлению результатов исследований в виде завершённых научно-исследовательских разработок: отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, магистерской диссертации;
1.9	научной объективности, аккуратности и точности в выполнении расчётов и экспериментов.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б2.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Высоковакуумное оборудование в нанoeлектронике	
2.1.2	Научно-исследовательская работа	
2.1.3	Основы предпринимательства	
2.1.4	Педагогическая практика	
2.1.5	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)	
2.1.6	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык)	
2.1.7	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)	
2.1.8	Приборы и устройства магнитоэлектроники	
2.1.9	Приборы и устройства на основе наносистем	
2.1.10	Проектирование и технология электронной компонентной базы	
2.1.11	Технология материалов экстремальной электроники	
2.1.12	Эпионная технология в микро- и наноиндустрии	
2.1.13	Компьютерные технологии в научных исследованиях	
2.1.14	Методы исследования материалов	
2.1.15	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур	
2.1.16	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии	
2.1.17	Научно-исследовательская практика	
2.1.18	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций	
2.1.19	Радиационно-технологические процессы в электронике	
2.1.20	Термодинамика и микротехнология многокомпонентных гетероструктур	
2.1.21	Технологии получения материалов	
2.1.22	Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)	
2.1.23	Актуальные проблемы современной электроники и нанoeлектроники	
2.1.24	История и методология науки и техники в области электроники	
2.1.25	Конструирование светоизлучающих устройств	
2.1.26	Конструирование фотопреобразователей	
2.1.27	Методы математического моделирования	
2.1.28	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур	
2.1.29	Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Знать:
ОПК-2-32 Современное научно-исследовательское и измерительное оборудование
ОПК-2-31 Современные методы исследования объектов и процессов нанoeлектроники
ОПК-4: Способен проектировать, разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей
Знать:
ОПК-4-32 Задачи решаемые при моделировании объектов и технологий нанoeлектроники
ОПК-4-31 Специализированное программно-математическое обеспечение
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
УК-4-32 Методы математического моделирования объектов и процессов
УК-4-31 Поисковые системы и базы данных для получения информации об объекте исследования
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, участвовать в обучении на протяжении всей жизни
Знать:
УК-6-31 Способы повышения квалификации и самообразования
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
УК-4-33 Новейшие технологии в области нанoeлектроники
ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций
Знать:
ПК-2-32 Режимы и параметры технологических процессов
ПК-2-31 Методы многопараметрической оптимизации
ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики, химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми эксплуатационными параметрами
Знать:
ПК-4-31 Материалы, технологические процессы и оборудование производства изделий микроэлектроники
ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы
Знать:
ПК-3-31 Основные экспериментальные методы нанoeлектроники
ОПК-4: Способен проектировать, разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей
Знать:
ОПК-4-34 Языки высокого уровня для разработки математического обеспечения
ОПК-4-33 Математические модели объектов и технологий нанoeлектроники
ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство
Знать:

ПК-1-31 Основные физико-химические принципы технологических процессов нанoeлектроники
ОПК-5: Способен демонстрировать практические навыки для решения сложных задач, выполнения сложного проектирования, а также проведения комплексных исследований, знание экономических, организационных и управленческих вопросов, таких как: управление проектами, рисками и изменениями
Знать:
ОПК-5-31 Методы по управления проектами, рисками и изменениями
УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
УК-3-32 Задачи, решаемые при проектировании и разработке новой продукции в рамках междисциплинарных областей
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
УК-2-31 Методы математического моделирования
УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
УК-3-33 Передовые методы и технологии проектирования
УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий
Знать:
УК-1-31 Актуальные аналитические, вычислительные и экспериментальные методы нанoeлектроники
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
УК-2-33 Продукцию, процессы и системы междисциплинарных областей
УК-2-32 Экспериментальные методы исследования объектов
УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
УК-3-31 Знать продукцию, процессы и системы нанoeлектроники
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-2-У3 Представлять результаты исследований в виде графического и информационного материалы
ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций
Уметь:
ПК-2-У1 Составлять задачи многопараметрической оптимизации технологических процессов нанoeлектроники
УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Уметь:
УК-1-У1 Анализировать сложные инженерные объекты, процессы и системы для решения проблемных ситуаций
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
УК-2-У2 Использовать вычислительные методы для решения поставленных задач
ОПК-5: Способен демонстрировать практические навыки для решения сложных задач, выполнения сложного проектирования, а также проведения комплексных исследований, знание экономических, организационных и управленческих вопросов, таких как: управление проектами, рисками и изменениями
Уметь:
ОПК-5-У1 Проводить комплексные исследования при проектировании объектов нанoeлектроники
ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство
Уметь:
ПК-1-У1 Разрабатывать новые технологические процессы нанoeлектроники в соответствии с поставленными задачами
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
УК-2-У3 Анализировать имеющуюся информацию об объектах для постановки новых нестандартных задач
ОПК-4: Способен проектировать, разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей
Уметь:
ОПК-4-У3 Разрабатывать математические модели объектов и технологий нанoeлектроники
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Уметь:
УК-2-У1 Проводить экспериментальное исследование объектов нанoeлектроники
ОПК-4: Способен проектировать, разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей
Уметь:
ОПК-4-У1 Применять программно-математическое обеспечение для решения инженерных задач
ОПК-4-У2 Разрабатывать программы для проведения исследований и решения инженерных задач
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Уметь:
УК-4-У3 Строить модели объектов и процессов
УК-4-У4 Анализировать возможности новых технологий
ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики, химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми эксплуатационными параметрами
Уметь:
ПК-4-У1 Анализировать свойства материалов, режимы и параметры технологических процессов для оптимизации производства изделий микроэлектроники
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Уметь:

УК-4-У2 Осуществлять информацию об объекте исследования в базах данных
УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Уметь:
УК-3-У2 Выбирать и применять передовые методы и технологии проектирования
УК-3-У1 Решать задачи проектирования продукции, процессов и систем с целью получения требуемых параметров и характеристик
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Уметь:
УК-4-У1 Осуществлять поиск литературы о заданном объекте исследования
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-2-У1 Использовать научно-исследовательское и измерительное оборудование для проведения экспериментальных работ
ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы
Уметь:
ПК-3-У1 Осваивать новые экспериментальные методы и технологические процессы
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-2-У2 Обрабатывать и анализировать результаты научных исследований
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, участвовать в обучении на протяжении всей жизни
Уметь:
УК-6-У1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ПК-4: Способность выявлять и реализовывать перспективные направления исследований в области физики, химии, микро- и нанотехнологий гетерокомпозиций полупроводниковых и диэлектрических материалов с целью получения недеградирующих микро- и наноструктур с контролируемыми свойствами и требуемыми эксплуатационными параметрами
Владеть:
ПК-4-В1 Методами работы с оборудованием технологических процессов наноэлектроники
ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций
Владеть:
ПК-2-В1 Методами оптимизации технологических процессов наноэлектроники для решения поставленных задач
ПК-3: Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы
Владеть:
ПК-3-В1 Навыками проведения экспериментальных работ и технологических процессов
УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий
Владеть:
УК-1-В1 Аналитическими, вычислительными и экспериментальными методами выработки стратегии решения проблемных ситуаций

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство
Владеть:
ПК-1-В1 Методами разработки и внедрения новых технологических процессов наноэлектроники
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Владеть:
УК-4-В3 Методами анализа характеристик и возможностей новых технологий с целью их применения
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, участвовать в обучении на протяжении всей жизни
Владеть:
УК-6-В1 Методами самооценки и самообразования для реализации собственной деятельности
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-2-В1 Навыками самостоятельного применения научно-исследовательского и измерительного оборудования для решения поставленных задач
УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Владеть:
УК-3-В1 Методами анализа методов и технологий проектирования с целью разработки новых и оригинальных методов проектирования и разработки
УК-4: Способен эффективно функционировать в национальном и международном коллективах в качестве члена или лидера команды, применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Владеть:
УК-4-В1 Методами поиска, систематизации, хранения и анализа информации об объектах исследования
УК-4-В2 Методами моделирования объектов и процессов и проведения расчетов с целью научного исследования
ОПК-4: Способен проектировать, разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках междисциплинарных областей
Владеть:
ОПК-4-В1 Методами решения инженерных задач и проведения исследований с помощью стандартного и специально разработанного программно-математического обеспечения
ОПК-4-В2 Методами расчета для решения инженерных задач
ОПК-5: Способен демонстрировать практические навыки для решения сложных задач, выполнения сложного проектирования, а также проведения комплексных исследований, знание экономических, организационных и управленческих вопросов, таких как: управление проектами, рисками и изменениями
Владеть:
ОПК-5-В1 Навыками решения сложных комплексных задач при проектировании, включающих экономические, организационные и управленческие вопросы
ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-2-В2 Способностью защищать результаты выполненной работы
УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Владеть:
УК-2-В1 Методами решения новых нестандартных задач в условиях неопределенности и альтернативных решений

УК-3: Способен использовать различные методы ясного и недвусмысленного формулирования своих выводов, знаний и обоснований для специализированной и неспециализированной аудиторий в национальном и международном контекстах, организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Владеть:

УК-3-В2 Методами проектирования и разработки новой продукции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Получение задания от руководителя. Составление плана работы							
1.1	Получение задания на практику. Уяснение целей и задач /Ср/	4	2	УК-3-32 ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7 Л2.13 Л2.15 Л2.18 Л2.20 Л2.25 Л2.28 Л2.34 Л2.39 Э1 Э2 Э3		КМ1	Р1
1.2	Получение и анализ исходных данных /Ср/	4	8	УК-2-У3 УК-3-31 УК-3-32 УК-3-33 УК-4-31 УК-4-33 УК-4-У1 УК-4-У2 УК-4-У4 УК-4-В1 УК-4-В3 УК-6-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7 Л2.13 Л2.15 Л2.18 Л2.20 Л2.25 Л2.28 Л2.34 Л2.39 Э1 Э2 Э3			
1.3	Составление плана проведения работы /Ср/	4	4	УК-2-У3 УК-3-32 УК-6-31 УК-6-В1 ОПК-2-31 ОПК-2-32 ОПК-4-32 ОПК-5-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7 Л2.13 Л2.15 Л2.18 Л2.20 Л2.25 Л2.28 Л2.34 Л2.39Л3.1 Э1 Э2 Э3			
	Раздел 2. Анализ литературных данных. Теоретическое обоснование работы							
2.1	Поиск и систематизация литературных данных по теме практики /Ср/	4	36	УК-1-31 УК-3-31 УК-3-32 УК-4-31 УК-4-У1 УК-4-У2 ОПК-4-32 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.13 Л2.16 Л2.18 Л2.19 Л2.20 Л2.23 Л2.27 Л2.38 Л2.39 Э1 Э2 Э3			

2.2	Анализ литературных данных, формулировка основных выводов, уточнение плана проведения работ /Ср/	4	54	УК-1-У1 УК-2-33 УК-2-У3 УК-3-31 УК-3-32 УК-3-33 УК-3-У2 УК-3-В1 УК-4-У4 УК-4-В1 УК-4-В3 УК-6-У1 УК-6-В1 ОПК-4-32 ОПК-5-31 ПК-1-31 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
2.3	Поиск и анализ существующих моделей объектов и технологий /Ср/	4	54	УК-3-32 УК-3-33 УК-3-У2 УК-4-31 УК-4-У1 УК-4-В1 ОПК-4-31 ОПК-4-32 ОПК-4-33 ПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
2.4	Написание литературного обзора по теме практики /Ср/	4	40	УК-1-У1 УК-1-В1 УК-2-33 УК-2-У3 УК-3-32 УК-3-33 УК-3-В1 УК-4-У4 УК-4-В3 УК-6-У1 ОПК-2-У2 ОПК-2-У3 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
Раздел 3. Проведение научных исследований								
3.1	Изучение конструкции и технологии изготовления электронных структур, выбранных для проведения исследований, анализ их основных характеристик и параметров /Ср/	4	40	УК-1-31 УК-1-У1 УК-1-В1 УК-2-32 УК-2-33 УК-2-У1 УК-3-У2 УК-3-В1 УК-4-33 ОПК-2-31 ОПК-2-32 ОПК-2-У1 ОПК-2-В1 ПК-1-31 ПК-1-В1 ПК-2-32 ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.17 Л2.18 Л2.19 Л2.25 Л2.29 Л2.30 Л2.31 Л2.32 Л2.33 Л2.41Л3.1 Э1 Э2 Э3			
3.2	Изучение методов и методик проведения исследований. Обоснование выбора экспериментальных методов исследования /Ср/	4	40	УК-1-31 УК-1-В1 УК-2-32 УК-2-У1 УК-3-33 УК-3-У1 УК-3-У2 УК-4-33 УК-4-У4 ОПК-2-31 ОПК-2-32 ОПК-2-У1 ОПК-5-У1 ПК-1-31 ПК-2-32 ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.8 Л2.14 Л2.18 Л2.22 Л2.35Л3.1 Э1 Э2 Э3			

3.3	Выполнение самостоятельных экспериментальных исследований по теме практики /Ср/	4	156	УК-1-31 УК-1-У1 УК-1-В1 УК-2-33 УК-2-У1 УК-2-В1 УК-3-31 УК-3-33 УК-3-У2 УК-4-33 ОПК-2-31 ОПК-2-32 ОПК-2-У1 ОПК-2-В1 ОПК-4-В1 ОПК-5-У1 ПК-1-31 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1 ПК-3-31 ПК-3-У1 ПК-3-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.11 Л2.13 Л2.14 Л2.17 Л2.18 Л2.20 Л2.22 Л2.32 Л2.33 Л2.37 Л2.38 Л2.39 Л2.41Л3.1 Э1 Э2 Э3			
3.4	Моделирование исследуемых объектов и технологий. Проведение численных расчетов /Ср/	4	148	УК-1-31 УК-1-В1 УК-2-31 УК-2-У2 УК-2-В1 УК-3-В2 УК-4-32 УК-4-У3 УК-4-В2 ОПК-4-31 ОПК-4-32 ОПК-4-33 ОПК-4-34 ОПК-4-У1 ОПК-4-У2 ОПК-4-У3 ОПК-4-В1 ОПК-4-В2 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.9 Л2.10 Л2.12 Л2.13 Л2.17 Л2.18 Л2.20 Л2.23 Л2.24 Л2.26 Л2.27 Л2.28 Л2.30 Л2.32 Л2.38Л3.1 Э1 Э2 Э3			
3.5	Анализ полученных результатов. Сравнение с литературными данными /Ср/	4	42	УК-1-31 УК-1-У1 УК-1-В1 УК-2-32 УК-2-33 УК-2-У3 УК-3-31 УК-3-В1 УК-4-33 УК-4-У4 УК-4-В3 ОПК-2-У2 ОПК-4-В1 ОПК-5-У1 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.11 Л2.14 Л2.18 Л2.19 Л2.20 Л2.22 Л2.25 Л2.28 Л2.29 Л2.30 Л2.31 Л2.33 Л2.34 Л2.35 Л2.37 Л2.39 Л2.41Л3.1 Э1 Э2 Э3			
	Раздел 4. Обобщение результатов. Подготовка отчета							
4.1	Обобщение результатов. Подготовка выводов по работе /Ср/	4	56	УК-1-У1 УК-1-В1 УК-2-У3 УК-2-В1 УК-3-32 УК-3-33 УК-3-У1 УК-3-У2 УК-3-В1 УК-3-В2 УК-4-У4 УК-4-В1 УК-4-В3 ОПК-2-У2 ОПК-5-У1 ОПК-5-В1 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.11 Л2.13 Л2.15 Л2.21 Л2.23 Л2.25 Л2.30 Л2.36 Л2.37 Л2.39 Л2.40 Э1 Э2 Э3			

4.2	Подготовка графических и информационных материалов по работе /Ср/	4	36	ОПК-2-31 ОПК-2-В2 ОПК-4-32 ОПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.6 Л2.17 Л2.23 Л2.36 Л2.39 Э1 Э2 Э3			
4.3	Написание отчета по работе /Ср/	4	40	УК-1-31 УК-1-У1 УК-2-У3 УК-2-В1 УК-3-32 УК-3-33 УК-3-У1 УК-3-В1 УК-3-В2 УК-4-У3 УК-4-В3 УК-4-В3 ОПК-2-31 ОПК-2-У2 ОПК-2-У3 ОПК-2-В2 ПК-1-У1 ПК-1-В1 ПК-2-31 ПК-2-32 ПК-2-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.8 Л2.11 Л2.14 Л2.17 Л2.19 Л2.20 Л2.22 Л2.23 Л2.25 Л2.29 Л2.30 Л2.31 Л2.32 Л2.33 Л2.36 Л2.39 Л2.41 Э1 Э2 Э3		КМ2	Р2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Получение задания на практику	ОПК-2-31;УК-3-32	1. Поясните суть задания и порядок выполнения. 2. Электронные ресурсы для поиска информации о задании. 3. Порядок выполнения работы, место, отчетность. 4. Современные методы исследования объектов и процессов нанoeлектроники. 5. Опишите междисциплинарные задачи, требующие решения в вашей работе.

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Получение задания	ОПК-2-31;УК-3-32	Получение задания

P2	Подготовка и защита отчета	<p>ОПК-5-31;ОПК-5-У1;ОПК-5-В1;ОПК-4-31;ОПК-4-32;ОПК-4-33;ОПК-4-34;ОПК-4-У1;ОПК-4-У2;ОПК-4-У3;ОПК-4-В1;ОПК-4-В2;ОПК-2-31;ОПК-2-32;ОПК-2-У1;ОПК-2-У2;ОПК-2-У3;ОПК-2-В1;ОПК-2-В2;УК-4-31;УК-4-32;УК-4-33;УК-4-У1;УК-4-У2;УК-4-У3;УК-4-У4;УК-4-В1;УК-4-В2;УК-4-В3;УК-3-31;УК-3-32;УК-3-33;УК-3-У1;УК-3-У2;УК-3-В1;УК-3-В2;УК-2-31;УК-2-32;УК-2-33;УК-2-У1;УК-2-У2;УК-2-У3;УК-2-В1;УК-1-31;УК-1-У1;УК-1-В1;УК-6-31;УК-6-У1;УК-6-В1;ПК-1-31;ПК-1-У1;ПК-1-В1;ПК-2-31;ПК-2-32;ПК-2-У1;ПК-2-В1;ПК-3-31;ПК-3-У1;ПК-3-В1</p>	<p>Как правило практика проводится на предприятиях и научно-исследовательских учреждениях наноэлектроники. Например: АО «НПП «Квант», г. Москва Акционерное общество "Оптрон", г. Москва АО "НИИ" Полнос "им. М. Ф. Стельмаха", г. Москва АО "МЗ "Сапфир", г. Москва ООО "РИИС", г. Москва АО "ЦНИИАГ", г. Москва</p> <p>В отдельных случаях практика проводится на кафедре ППЭ и ФПП или научно-исследовательских лабораториях НИТУ "МИСиС"</p> <p>Для прохождения научно-исследовательской практики студенту выдается индивидуальное задание. Примерные индивидуальные задания: 1. Подбор оптимального режима процесса фотолитографии при изготовлении фотопреобразователей. 2. Измерение параметров транзисторных оптопар при воздействии внешних факторов. 3. Получение системы твердых растворов AlGaInAs/InP методом МОС-гидридной эпитаксии. 4. Отработка технологии изготовления германиевого лавинного фотодиода с защитной фоторезистивной маской. 5. Исследование электрических свойств и спектров глубоких центров в синих и УФ светодиодах с квантовой ямой GaN/InGaN и подслоем InAlN. 6. Изучение характеристик глубоких объёмных и поверхностных ловушек в оксиде галлия. 7. Детектор ядерных частиц на основе синтетического монокристаллического алмаза. 8. Изучение ВФХ МДП-структур на основе АОП, полученных в электролитах на основе сернистого натрия и персульфата аммония в ГС и КГС режимах. 9. Система диспетчерского контроля АПК-ДК. 10. Расчеты концентраций СТД в CdS в характерных точках области гомогенности. 11. Исследование методов улучшения навигационного оборудования, использующегося на подвижной базе. 12. Исследование параметров фотодиодов с расширенным спектральным диапазоном. 13. Влияние внешних полей на электрофизические параметры. 14. Создание методики для исследования влияния температуры на емкостные характеристики структуры GaAs(Ni)-GaAs (Te). 15. Расчет объемного рекомбинационного времени жизни СНЗ по измеренному эффективному. 16. Однородность распределения УЭС пластин БЗП кремния. 17. Сравнительный анализ расчетных и экспериментально установленных параметров контактных структур фотопреобразователей на основе соединений АПВВ. 18. Изучение воздействия высокоэнергетического облучения на параметры AlGaP светодиодов. 19. Исследование влияния облучения на характеристики InGaN светодиодов.</p> <p>По практике предусматривается отчет в следующих формах: письменный отчет по практике, презентационные материалы. Краткий отчет по практике (не менее 10 страниц рукописного или напечатанного текста на одной стороне листа стандартного формата). Необходимые чертежи и схемы выполняются на листах того же формата и вшиваются в отчет. Отчет подписывается студентом и руководителем практики от предприятия. Кроме того, на титульном листе отчета по практике должна быть подпись ОТО предприятия, заверенная печатью. Отчет по практике составляется по материалам дневника, который ежедневно заполняется студентом по мере прохождения практики и выполнения индивидуального задания. Форма дневника предоставляется студентам перед началом практики. В отчет входят:</p>
----	----------------------------	---	---

			<p>1) титульный лист; 2) индивидуальное задание; 4) отчет о выполнении каждого из вопросов индивидуального плана задания; 5) конспективное изложение материалов лекций и экскурсий; 6) список использованных источников.</p> <p>Отчет набирается на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4 с соблюдением ГОСТа 7.32-2017. Все листы должны иметь сквозную нумерацию. Текст отчета разбивается на разделы в соответствии с разделами индивидуального задания. Перечень разделов и подразделов с указанием номеров страниц приводятся в содержании. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию. Сокращение слов в отчете не допускается. Наименования и обозначения единиц измерения должны соответствовать системе СИ. Заимствованные из литературы материалы приводятся со ссылкой на источник, а формулы – с расшифровкой входящих в них величин. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. Все листы должны быть сброшюрованы. Лучшие отчеты могут быть представлены на факультетский и университетский конкурсы.</p>
--	--	--	---

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен по дисциплине не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

Оценку за научно-исследовательскую практику во 4 семестре выставляет руководитель на основе решения комиссии, заслушивающей доклад обучающегося по результатам практики.

Перед комиссией студент демонстрирует презентацию работы и делает краткий доклад, в котором отражает задачи работы, использованные методики, основные результаты и выводы (заключение); затем члены комиссии производят опрос студента по содержанию научно-исследовательской практики и выставляют зачет с дифференцированной оценкой.

Если студент выполнил научно-исследовательскую практику в полном объеме, но неудовлетворительно оформил отчет или неудовлетворительно отвечал на вопросы комиссии, то ему предоставляется возможность повторной защиты на соответствующем семинаре в срок, устанавливаемый заведующим кафедрой.

Студент, не выполнивший задачи научно-исследовательской практики в установленном объеме (в соответствии с заданием), не допускается к защите практики. Повторное прохождение практики не допускается. Студент, не получивший зачет по научно-исследовательской практике до начала нового учебного года, отчисляется из университета.

Методика оценки защиты результатов выполненной научно-исследовательской практики.

1. Отлично:

- содержание отчета полностью соответствует тематике научно-исследовательской практики;
- отчет оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа;
- отчет сдан в установленные сроки;
- при защите студент полно и четко ответил на поставленные вопросы

2. Хорошо:

- содержание отчета полностью соответствует тематике научно-исследовательской практики;
- отчет оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа;
- отчет сдан в установленные сроки;
- при защите студент полно и четко ответил на большинство поставленных вопросов.

3. Удовлетворительно:

- содержание отчета в основном соответствует тематике научно-исследовательской практики;
- отчет оформлен не в полном соответствии с требованиями ГОСТа,;
- нарушены сроки сдачи отчет;
- при защите студент допускает ошибки при ответе на поставленные вопросы;

4. Неудовлетворительно:

- содержание отчета не раскрывает тему научно-исследовательской практики;
- оформление отчета не соответствует требованиям ГОСТа,;
- нарушены сроки сдачи отчет;
- при защите студент допускает грубые ошибки, не понимает сути и путается при ответе на поставленные вопросы;

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Горелик С. С., Дашевский М. Я.	Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учебник для студ. вузов по напр. 'Материаловедение и технология новых материалов', 'Материаловедение, технологии материалов и покрытий'	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2003
Л1.2	Степаненко И. П.	Основы микроэлектроники: Учеб. пособие для вузов по спец. 'Полупроводники и диэлектрики' и 'Полупроводниковые и микроэлектронные приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Сов.радио, 1980
Л1.3	Кожитов Л. В., Косушкин В. Г., Крапухин В. В., Пархоменко Ю. Н.	Технология материалов микро- и нанoeлектроники	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2007
Л1.4	Курносое А. И., Юдин В. В.	Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем: Учеб. пособие для вузов по спец. 'Полупроводники и диэлектрики' и 'Полупроводниковые приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1986
Л1.5	Шалимова К. В.	Физика полупроводников: Учебник для вузов по спец. 'Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Энергоатомиздат, 1985

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Кларк Э. Р., Эберхардт К. Н., Баженов С. Л.	Микроскопические методы исследования материалов: монография	Электронная библиотека	Москва: РИЦ Техносфера, 2007
Л2.2	Троян П. Е., Сахаров Ю. В.	Нанoeлектроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010
Л2.3	Спицын В. Г.	Информационная безопасность вычислительной техники: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Эль Контент, 2011
Л2.4	Рытенкова О.	Информационная безопасность: журнал	Электронная библиотека	Москва: ГРОТЕК, 2013
Л2.5	Сафин Р. Г., Тимербаев Н. Ф., Иванов А. И.	Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное пособие	Электронная библиотека	Казань: Казанский научно- исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013
Л2.6	Крутиков В. Н., Мешечкин В. В.	Анализ данных: учебное пособие	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.7	Попов А. А.	Оптимальное планирование эксперимента в задачах структурной и параметрической идентификации моделей многофакторных систем: монография	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013
Л2.8	Груздов В. В., Колковский Ю. В., Концевой Ю. А.	Контроль новых технологий в твердотельной СВЧ электронике: монография	Электронная библиотека	Москва: Техносфера, 2016
Л2.9	Калиткин Н. Н., Самарский А. А.	Численные методы	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1978
Л2.10	Самарский А. А.	Введение в теорию разностных схем	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1971
Л2.11	Истомина А. П.	Анализ данных качественных исследований: практикум	Электронная библиотека	Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016
Л2.12	Тихонов А. Н., Самарский А. А.	Уравнения математической физики	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1977
Л2.13	Медведев П. В., Федотов В. А.	Математическое планирование эксперимента: учебное пособие	Электронная библиотека	Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017
Л2.14	Груздов В. В., Колковский Ю. В., Концевой Ю. А.	Входной и технологический контроль материалов и структур в твердотельной СВЧ электронике: методические указания по выполнению лабораторных работ для магистров, с направлением подготовки по специальности 11.04.04 и аспирантов с направлением подготовки по специальностям 05.27.01 и 05.27.06: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Техносфера, 2017
Л2.15	Гиссин В. И.	Планирование эксперимента и обработка результатов: учебное пособие	Электронная библиотека	Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018
Л2.16	Ищейнов В. Я.	Информационная безопасность и защита информации: теория и практика: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020
Л2.17	Королёв М. А., Крупкина Т. Ю., Ревелева М. А., Чаплыгин Ю. А.	Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем	Электронная библиотека	Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
Л2.18	Раннев Г. Г., Суругина В. А., Калашников В. И., др., Раннев Г. Г.	Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Электроэнергетика"	Библиотека МИСиС	М.: АCADEMIA, 2009
Л2.19	Герасименко Н. Н., Пархоменко Ю. Н.	Кремний - материал нанoeлектроники: учеб. пособие для студ. вузов спец. 210600 - 'Нанотехнология' и спец. 210100 - 'Электроника и микроэлектроника'	Библиотека МИСиС	М.: Техносфера, 2007

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.20	Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Иванов А. Н., Расторгуев Л. Н.	Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учебник для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1982
Л2.21	Румшицкий Л. З.	Математическая обработка результатов эксперимента: справ. руководство	Библиотека МИСиС	М.: Наука, 1971
Л2.22	Батавин В. В., Крутогин Д. Г., Курочка С. П., Подгорная С. В.	Метрология, стандартизация и сертификация. Основы метрологии в электронике: Курс лекций	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2004
Л2.23	Орлова М. Н., Борзых И. В.	Микроэлектроника: лаб. практикум	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2010
Л2.24	Юрчук С. Ю., Орлова М. Н.	Основы математического моделирования: учеб. пособие	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2009
Л2.25	Крапухин В. В., Соколов И. А., Кузнецов Г. Д.	Технология материалов электронной техники: Теория процессов полупроводниковой технологии: Учебник для вузов	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 1995
Л2.26	Юрчук С. Ю.	Математическое моделирование технологических процессов электронной техники: Лаб. практикум для студ. спец. 20.02	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1997
Л2.27	Юрчук С. Ю.	Математические модели технологических процессов, приборов и интегральных схем: Учеб. пособие для практ. занятий студ. спец. 200.200	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1999
Л2.28	Лопатин В. Ю.	Организация и планирование эксперимента: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1996
Л2.29	Ладыгин Е. А., Паничкин А. В., Горюнов Н. Н., др. Е. А., Ладыгин	Основы радиационной технологии микроэлектроники: Разд.: Первичные процессы образования радиационных центров в полупроводниковых кристаллах: курс лекций для студ. спец. 20.03	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1994
Л2.30	Полистанский Ю. Г., Александрова Е. А.	Физическая химия и технология полупроводниковых материалов и элементов микроэлектроники: Метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 0643, 0604	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1986
Л2.31	Ладыгин Е. А., Горюнов Н. Н., Паничкин А. В., Галеев А. П.	Основы радиационной технологии микроэлектроники: Разд.: Радиационные эффекты в интегральных микросхемах: курс лекций для студ. спец. 06.29	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1996

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.32	Ладыгин Е. А., Курносов А. И., Савков Г. Н., Мельников А. Л., Ладыгин Е. А.	Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем: Разд.: Основные процессы планарной технологии полупроводниковых приборов и интегральных схем: лаб. практикум для студ. спец. 20.02, 20.03	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1989
Л2.33	Груздева Г. А.	Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем: Разд.: Фотолитография и окисление в планарной технологии: Учеб. пособие для студ. спец. 0629	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1981
Л2.34	Лопатин В. Ю.	Математическое планирование эксперимента: Ч.1: Выбор факторов и параметра оптимизации. Планы первого порядка: Курс лекций для студ. спец. 1108	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1999
Л2.35	Батавин В. В.	Основы метрологии: Учеб. пособие для студ. спец. 2001, 2002, 0710 и направл. 5507	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2001
Л2.36	Мельниченко А. С.	Анализ данных в материаловедении. Ч. 1: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 150700 - Физическое материаловедение и Металлургия	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2013
Л2.37	Адлер Ю. П.	Введение в планирование экспериментов: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2014
Л2.38	Юрчук С. Ю.	Методы математического моделирования (N 2938): учеб. пособие	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2018
Л2.39	Зебрев Г. И.	Физические основы кремниевой наноэлектроники: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2020
Л2.40	Крутиков В. Н., Мешечкин В. В.	Методы оптимизации: учебное пособие	Электронная библиотека	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019
Л2.41	Груздева Г. А., Курносов А. И., Ладыгин Е. А.	Технология полупроводниковых приборов и интегральных схем: Разд.: Интегральные микросхемы: Учеб. пособие для студ. спец. 0604, 0643, 0629	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1982

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Легостаев Н. С., Четвергов К. В.	Твердотельная электроника: методические указания: методическое пособие	Электронная библиотека	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Электронная библиотека МИСиС	http://lib.misis.ru/elbib.html		
----	------------------------------	---	--	--

Э2	Полнотекстовая Университетская библиотека онлайн	http://biblioclub.ru/
Э3	Электронно-библиотечная система ЛАНЬ	https://e.lanbook.com/
6.3 Перечень программного обеспечения		
П.1	ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОМ ООО	
П.2	Microsoft Office	
П.3	LMS Canvas	
П.4	MS Teams	
П.5	MATCAD	
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных		
И.1	Полнотекстовые российские научные журналы и статьи:	
И.2	— научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/	
И.3	— полнотекстовые деловые публикации информгентств и прессы по 53 отраслям https://polpred.com/news	
И.4	- иностранные базы данных (доступ с IP адресов МИСиС):	
И.5	— аналитическая база (индексы цитирования) Web of Science https://apps.webofknowledge.com	
И.6	— аналитическая база (индексы цитирования) Scopus https://www.scopus.com/	
И.7	— наукометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com	
И.8	— научные журналы издательства Elsevier https://www.sciencedirect.com/	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
Читальный зал №3 (Б)		комплект учебной мебели на 44 места для обучающихся, МФУ Xerox VersaLink B7025 с функцией масштабирования текстов и изображений, 8 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Читальный зал №4 (Б)		комплект учебной мебели на 20 рабочих мест, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
К-427	Учебная аудитория	стационарные компьютеры 6 шт., 4 ноутбука, пакет лицензионных программ MS Office, набор демонстрационного оборудования в том числе: доска учебная, мультимедийный проектор, экран проекционный, комплект учебной мебели 25 посадочных мест
К-428	Учебная аудитория	4 лабораторные установки, установка для роста углеродных нанотрубок методом PECVD, печь ИК нагрева MPA-5000, в том числе: доска учебная, монитор, системный блок, комплект учебной мебели на 20 посадочных мест
К-430	Лаборатория	комплект учебной мебели на 4 рабочих мест, оборудованных компьютерами, рабочее место преподавателя с персональным компьютером, без доступа к ИТС «Интернет»
К-431	Лаборатория «Материалов оптоэлектроники»:	спектрофотометр, компьютеры со специальным программным обеспечением для проведения занятий по моделированию, комплект лабораторного оборудования, комплект учебной мебели на 6 посадочных мес

К-433	Лаборатория	установки для напыления пленок УВН (4 шт.), вакуумный пост ВУП-5, установка для травления Плазма 600, микроинтерферометр МИИ-4, набор демонстрационного оборудования, в том числе: мультимедийный проектор, экран проекционный, комплект учебной мебели на 20 посадочных мест
К-434	Лаборатория	комплект учебной мебели на 3 рабочих мест, рабочее место преподавателя с персональным компьютером, без доступа к ИТС «Интернет»
К-435	Лаборатория	спектральный эллипсометрический комплекс, векторный анализатор электрических цепей, петлемер индукционный, смеситель, магнитометр АТЕ-8702, комплект учебной мебели на 8 посадочных мест
К-436	Лаборатория	измеритель магнитной индукции, генератор, петлемер индукционный, установка МК-39, универсальная магнитооптическая установка на базе микроскопа NU-2E, комплект учебной мебели на 6 посадочных мест

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНИМ БАЗАМ ПРАКТИК (НИР)

Практика относится к обязательной части образовательной программы.

Научно-исследовательская практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов базовых дисциплин профессионального цикла, изученных ранее.

Научно-исследовательская практика предполагает как самостоятельную работу, так и освоение технологических операций процессов изготовления полупроводниковых приборов, измерения различных характеристик материалов и полупроводниковых приборов, подготовки тестовых образцов для различных методов исследования, освоение методик структурных исследований освоение методик проведения экспериментов по определению физических свойств и обработки экспериментальных данных.

Перед началом научно-исследовательской практики каждый студент получает индивидуальное задание, в соответствии с которым составляется план работ.

По окончании практики студенты получают отзыв руководителя практикой от предприятия, который непосредственно курировал работу.

По результатам практики студенты подготавливают отчет, защита которого осуществляется на комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Для защиты отчета студенты подготавливают презентацию.

Требования к докладу:

Презентация до 10 слайдов с примерной структурой:

Слайд 1 - Титульный лист (Тема, ФИО, группа, ФИО научного руководителя)

Слайд 2 - Цель и задачи исследования

Слайд 3 и далее по отчету

Слайд ... - Выводы

При оформлении необходимо избегать анимации, объемных текстур, гиперссылок и встроенного видео.